

<b>ECSIN - ECAMRICERT SRL</b>  Corso Stati Uniti 4 35127 Padova PD	Numero di accreditamento: <b>0699 L</b> Sede <b>B</b>
	Revisione: <b>4</b> Data: <b>27/08/2020</b>
	pag. <b>1</b> di <b>2</b> UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

## ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

### Acque/Waters

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Microplastiche/Microplastics (presenza/assenza)	MI_551_2019_Rev.0	Microscopia FTIR	

### Alimenti/Food, Mangimi/Animal feeding stuffs

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Microplastiche/Microplastics (presenza/assenza)	MI_551_2019_Rev.0	Microscopia FTIR	

### Materiali in polvere o dispersione (nanomateriali)/Powdered materials or dispersions (nanomaterials)

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
TEM-Circolarità/TEM-Circularity (0-1)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-Deviazione standard/TEM-Standard deviation (3.5-14 nm)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-Diametro massimo/TEM-Maximum Diameter (32-310 nm)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-Diametro minimo/TEM- Minimum Diameter (12-230)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-MAD/TEM-MAD (2.2-9.7 nm)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-Media/TEM-Average (20-282 nm)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-Mediana/TEM-Median (20-282 nm)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-Moda/TEM-Mode (21-287 nm)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-Primo quartile/TEM First quartile (18-273 nm)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-Rapporto d'aspetto/TEM-Aspect Ratio (0-1)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-Rotondità/TEM-Roundness (0-1)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-Solidità/TEM-Solidity (0-1)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	
TEM-Terzo quartile/TEM-Third quartile (22-292 nm)	MI_416_2018_Rev.0	Microscopia elettronica: TEM	

### Materiali solidi porosi/Porous solid materials, Polveri/Powders

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Area superficiale specifica/Specific surface area (1-108 m <sup>2</sup> /g)	ISO 9277:2010 - solo/only Met 6.3.1 e multipunto 7.2	Volumetria	

<b>ECSIN - ECAMRICERT SRL</b>  Corso Stati Uniti 4 35127 Padova PD	Numero di accreditamento: <b>0699 L Sede B</b>
	Revisione: <b>4</b> <span style="float: right;">Data: <b>27/08/2020</b></span>
	pag. <b>2</b> di <b>2</b> <span style="float: right;">UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018</span>

*Legenda*

L'eventuale simbolo (1) in corrispondenza della matrice indica:matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided for by the method but acceptable

MI = metodo di prova sviluppato dal laboratorio

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (\*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco

